

Institut für Experimentalphysik der Technischen Universität Graz

&

Institut für Physik der Universität Graz

LABORÜBUNGEN 2: ELEKTRIZITÄT, MAGNETISMUS, OPTIK

Übungsnummer: 4

Übungstitel: Interferometer (KFU)

Betreuer: Andreas Hohenau

Gruppennummer: 42

Name: Nico Eisner

Name: Philip Waldl

Mat. Nr.: 12214121

Mat. Nr.: 12214120

Datum der Übung: 01.12.2023

WS 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Voraussetzungen & Grundlagen	3
3	Versuchsanordnung	4
4	Geräteliste	5
5	Versuchsdurchführung & Messergebnisse	5
5.1	Teil 1	5
5.2	Teil 2	6
5.3	Teil 3	7
5.4	Teil 4	7
6	Auswertung und Unsicherheitsanalyse	8
7	Diskussion	8
8	Zusammenfassung	8
	Literatur	8

1 Aufgabenstellung

Das Experiment Interferometer gilt es folgende vier Aufgaben durchzuführen.

Der erste Teil besteht darin, den Einfluss der Größe einer Lichtquelle auf das Interferenzmuster eines Doppelspalt zu Demonstrieren und auch zu Erklären.

Im zweiten Teil wird der Einfluss der spektralen Breite des Lichtes, wie im ersten Teil, auf das Interferenzmuster eines Doppelspalt zu Demonstrieren und zu Erklären.

Im dritten Teil wird mithilfe des Doppelspalt-Interferenzmusters die Dicke einer Kunststoffschicht bestimmt.

Der vierte und letzte Teil besteht aus der Bestimmung der Größe der Lichtquelle bei welcher für Doppelspalten mit unterschiedlichem Spaltabstand das Licht noch räumlich kohärent ist.

Alle Informationen und Methodiken wurden uns von der Technischen Universität bereitgestellt [1].

2 Voraussetzungen & Grundlagen

Ein Interferenzmuster entsteht durch Überlagerung der Wellenfronten. Sendet man monochromatisches Licht aus einer Lichtquelle durch eine Sammellinse, so entstehen kugelförmige Wellenfronten. Treten diese kugelförmige Wellenfronten durch einen Doppelspalt, so treten aus dem Spalt phasengleiche kugelförmige Wellenfronten aus. Treffen dabei die Wellenfronten (Maxima und Minima) aufeinander, addieren sich diese konstruktiv. So entstehen größere Maxima und kleinere Minima. Durch phasengleichen Austritt der Wellenfronten aus dem Doppelspalt entstehen Interferenzen bei den Winkeln θ wo der Phasenverschub ein Vielfaches von 2π ist. Dies geschieht, wo die Differenz der Strecke Δs ein Vielfaches der Wellenlänge λ beträgt. m ist die Zahl der Ordnung.

$$\Delta s = d \sin(\theta_m) = m\lambda \tag{1}$$

Durch die Brennweite und den Abstand zum Doppelspalt der Linse L2 kann der absolute Abstand des 0-ten bis zum m -ten Maxima berechnet werden. m ist die Zahl der Ordnung.

$$b_m = f_2 \tan \arcsin\left(\frac{m\lambda}{d}\right) \tag{2}$$

Fügt man in den Strahlengang nun ein Material (Polyacrylat) mit unterschiedlichen Brechungsindex n und physikalischer Dicke t ein, so ändert sich auch die Lichtgeschwindigkeit im Medium. Dadurch braucht der Lichtstrahl länger um abgebildet zu werden. Durch diese Dauer verschiebt sich das 0-te Maximum. Es befindet sich daher nichtmehr bei $\Delta s_0 = 0$ sondern bei:

$$\Delta s_0 = d \sin(\theta_0) + t n_2 - t n_1 \tag{3}$$

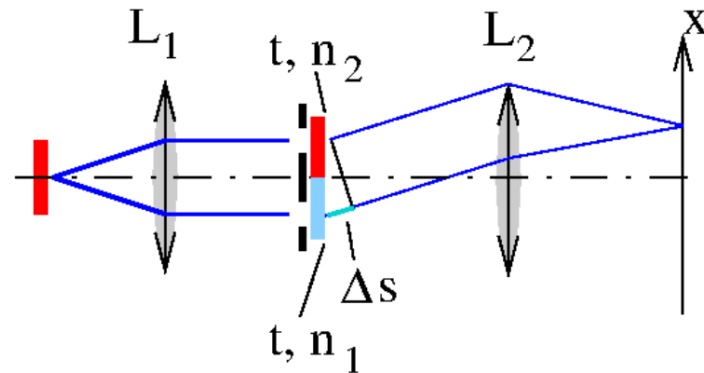


Abb. 1: Beugung am Doppelspalt mit Schichten unterschiedlicher Brechungsindizes n und Stärken t . Entnommen aus Skriptum Interferometer Seite 10, Abbildung 7 [1].

Durch Verschiebung der Lichtquelle verschiebt sich auch das Interferenzmuster. Die Lichtquelle ist im idealen Fall punktförmig, in diesem Fall besitzt sie eine gewisse Ausdehnung $2w$. Für jeden Punkt der Lichtquelle entstehen Interferenzmuster, welche sich überlagern. Man spricht hier von räumlicher Kohärenz, wenn unterschiedlichen Lichtquellen unterschiedliche Nullmaxima haben. Durch die Spaltblende wird dies auf eines begrenzt. In den später beobachtbaren Interferenzmustern wird dadurch der Kontrast K verringert. Dieser lässt sich mit folgender Formel bestimmen. Dabei ist I die Intensität.

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (4)$$

3 Versuchsanordnung

Der Versuch ist wie folgt aufgebaut.

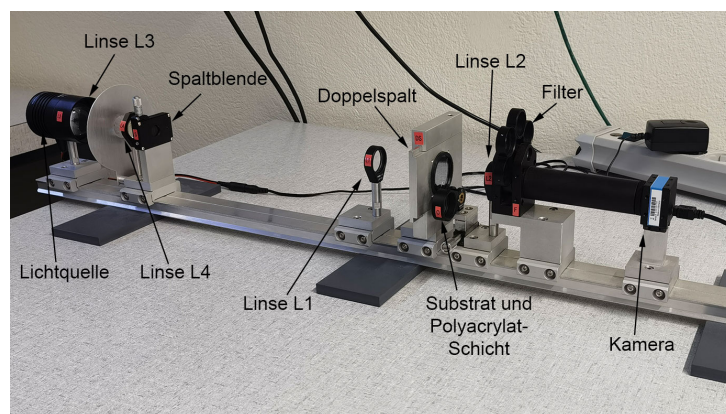


Abb. 2: Aufbau des Versuches.

Die Lichtquelle wird über eine einstellbare Spaltblende geleitet. Durch diese lässt sich die Größe der Lichtquelle einstellen. Durch die Linse L1 werden die Lichtstrahlen parallelisiert, bevor sie auf den Doppelspalt treffen. Nach dem Doppelspalt trifft das Licht auf ein Substrat. In diesem befindet sich die Polyacrylat-Schicht. Nach diesem trifft das Licht auf die Linse L2, welche das Licht auf den Kamerasensor lenkt. Zwischen Linse L2 und Kamera

befindet sich noch ein Filterradd, durch welches sich verschiedene Filter hinzugefügt werden können.

4 Geräteliste

Tab. 1: Im Versuch verwendete Geräte und Utensilien. Bei Geräten, dessen Unsicherheit nicht auffindbar ist, wird die Unsicherheit implizit angenommen oder die Ableseunsicherheit genommen.

Gerät	Gerätenummer	Unsicherheit
Lampe	Thorlabs QTH10/M	n.a
Sammellinsen	Thorlabs LMR1/M	$\pm 0.5mm$
Spaltblende	Thorlabs	$\pm 0.05mm$
Doppelspalte (130.0, 230.0, 430.0) μm	Mitutoyo	$\pm 0.5\mu m$
Substrat & Polyacrylat	Thorlabs TRF90/M	n.a
Kamera	n.a	n.a
Langpassfilter	n.a	n.a
Bandpassfilter $\lambda = 633nm$	n.a	$\pm 0.5nm$
IC Capture	n.a	n.a
Fiji ImageJ	n.a	n.a

5 Versuchsdurchführung & Messergebnisse

Der Versuch ist wie in Abbildung 2 bereits aufgebaut. Die Datenauslese erfolgt über den UniPC mit IC Capture. Bei den Aufnahmen ist es wichtig, vorher die Belichtungszeit einzustellen, so dass kein Pixel die Intensität von 255 überschreitet, da es ansonsten zu fehlerhaften Messdaten kommt. Mithilfe des Histogrammes wird geprüft, dass die Belichtungszeit dementsprechend gewählt wird. Die rechte Seite des Histogrammes sollte dabei nie die Intensität von 255 erreichen.

Anfangs gilt es den Öffnungsabstand der Spaltblende zu bestimmen. Dazu wird der 230.0 μm Doppelspalt verwendet und auf den Filterradd wird kein Filter zugeschalten. Der Spalt wird vollständig geschlossen. Durch langsames öffnen, bis ein Bild auf der Kamera zu erkennen ist wird der Offset bestimmt. Die Anzeige der Schraube wird abgelesen und bei den folgenden Werten miteinander berechnet. Die Abweichung beträgt $(0.35 \pm 0.05)mm$, das bedeutet, bei den folgenden Werten muss ein Offsetwert von 0.15mm dazugerechnet werden.

5.1 Teil 1

Im ersten Teil wird mit dem 430.0 μm Doppelspalt und dem Bandpassfilter gearbeitet. Der Lichtspalt der Spaltblende wird von einer Öffnung von 0.10 mm bis 1.5 mm geöffnet in 0.10 mm Schritten. Die Interferenzmuster werden dabei gespeichert. In der folgenden Abbildung werden die Interferenzmuster dargestellt, dabei ist das Oberste bei 1.5 mm. Die Öffnungen sind absteigend.

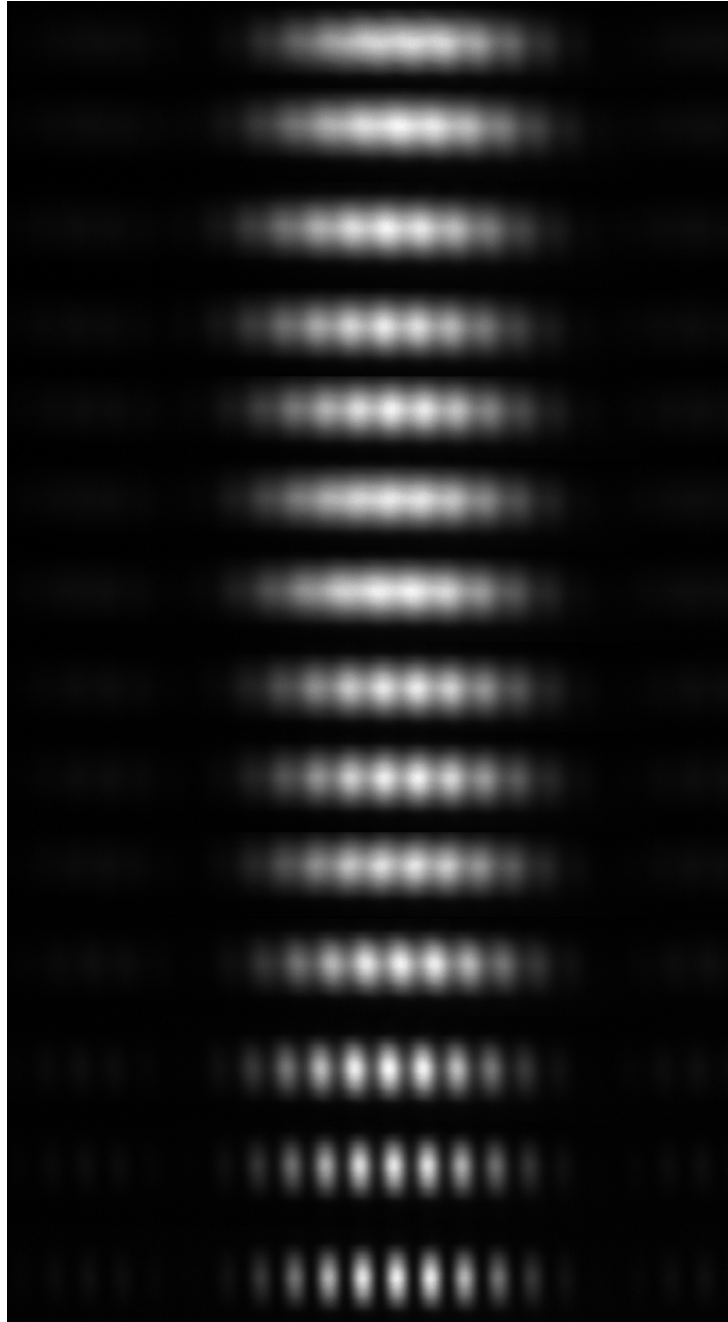


Abb. 3: Interferenzmuster bei einer Öffnung von 0.1 mm (unten) bis 1.5 mm (oben).

5.2 Teil 2

Im zweiten Teil bleibt der Doppelspalt mit $430.0 \mu\text{m}$. Es wird ein Interferenzmuster mit dem Langpassfilter, den Bandpassfilter und eines ohne Filter aufgenommen. Dazu schließt man die Spaltblende und mit den Bandpassfilter wird die Spaltblende geöffnet, bis ein kontrastreiches Interferenzmuster erkennbar ist.

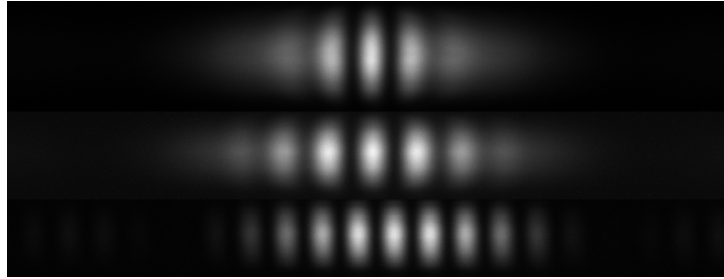


Abb. 4: Interferenzmuster mit verschiedenen Filter. Ohne Filter (oben), Langpassfilter (mitte), Bandpassfilter (unten)

5.3 Teil 3

Im dritten Teil gilt es die dicke einer Polyacrylatschicht zu bestimmen. Dazu wird derselbe Doppelspalt mit $430.0\ \mu\text{m}$ verwendet. Das Filterrad wird so eingestellt, dass kein Filter im Strahlengang ist. Die Probe wird in den Strahlengang gegeben. Durch drehen der Justageschraube lässt sich die Probe verschieben, so dass einmal das unbeschichtete Substrat im Strahlengang ist und einmal die Polyacrylat Schicht. Es wird jeweils ein Bild des Beugungsmusters aufgenommen. Einmal mit Verschiebung und einmal ohne. Bei überschreiten der Schichtgrenze zwischen Substrat und Polyacrylat ist ein sprunghafter Verschiebung des Beugungsmusters zu beobachten. Aus Teil 2 wird noch ein Referenzbild mit dem Bandpassfilter hinzugefügt.

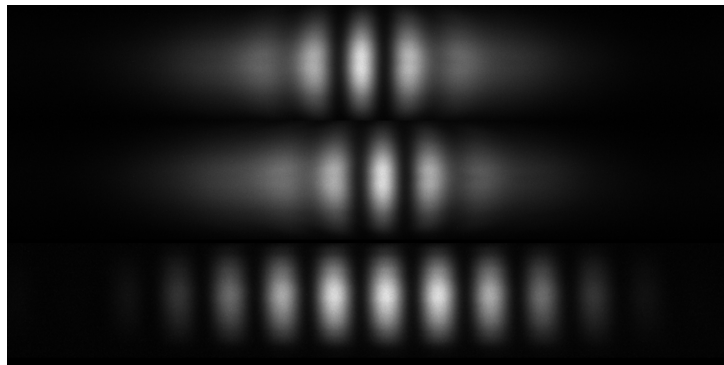


Abb. 5: Beugungsmuster mit Substrat (oben) und Polyacrylat Schicht (mitte). Referenzbild mit Bandpassfilter (unten)

5.4 Teil 4

Wie im vorherigen Teil bleibt der Bandpassfilter im Strahlengang. Der $130.0\ \mu\text{m}$ Doppelspalt wird in den Strahlengang gesetzt. Die Spaltblende wird geschlossen und dann langsam geöffnet, bis ein Interferenzmuster sichtbar wird. Durch weiteres öffnen verschwimmt das Interferenzmuster vollständig. Diese Öffnung der Spaltblende wird notiert. Die Spaltblende wird weiter geöffnet bis wieder Minima und Maxima erkennbar sind. Dieser Wert wird auch notiert. Dies wird für die weiteren Doppelspalte wiederholt.

Tab. 2: Öffnungen der Spaltblende bei verschwommenen Interferenzmuster und bei erkennbaren Minima und Maxima.

Doppelspalt ± 0.5 / μm	Öffnung verschwommen ± 0.05 / mm	Öffnung Min Max ± 0.05 / mm
430.0	0.85	1.05
230.0	1.02	1.35
130.0	1.65	0.75

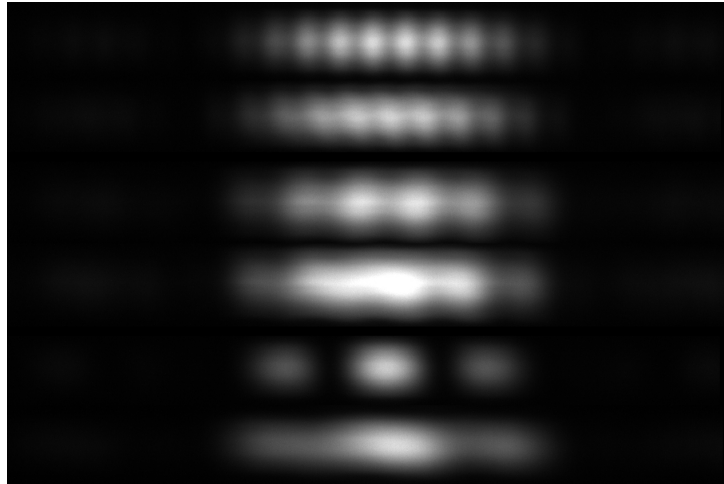


Abb. 6: Interferenzmuster aller Doppelspalte. Die beiden oberen sind die des $430.0 \mu\text{m}$ Spaltes, die mittleren die des $230.0 \mu\text{m}$ Spaltes und die unteren beiden die des $130.0 \mu\text{m}$ Spaltes. Dabei sind jeweils die ersten die verschwommenen und die zweiten die mit erkennbaren Minima und Maxima.

6 Auswertung und Unsicherheitsanalyse

In der Auswertung werden zur erhöhten Genauigkeit durchgehend ungerundete Werte bis zu den Endergebnissen verwendet und nur zur Darstellung gerundet.

Zur Berechnung der Unsicherheiten wird, wenn nicht anders angegeben, die Größtunsicherheitsmethode verwendet.

7 Diskussion

8 Zusammenfassung

Literatur

- [1] TU Graz TeachCenter. "Laborübungen 2: Elektrizität, Magnetismus, Optik". Kurs: PHYD30UF. (besucht am 01.12.2023). URL: <https://tc.tugraz.at/main/course/view.php?id=796>.